# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

09-216368

(43)Date of publication of application: 19.08.1997

(51)Int.CI.

B41J 2/135

(21)Application number: 08-025430

(71)Applicant:

SEIKO EPSON CORP

(22)Date of filing:

13.02.1996

(72)Inventor:

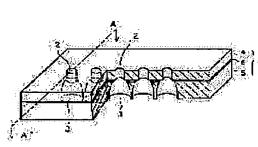
KAMISUKE SHINICHI

#### (54) INK JET NOZZLE PLATE AND ITS PRODUCTION

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To produce orifices and taper parts high in shape accuracy and to inexpensively provide an ink jet recording apparatus excellent in printing quality.

SOLUTION: Orifices 2 are formed to the active layer 4 of an SOI substrate 1 by plasma etching and taper parts 3 are formed to the part corresponding to the support 5 of the SOI substrate 1 to form an ink jet nozzle plate. The taper parts 3 are formed by alkali anisotropic etching or by alkali anisotropic etching and plasma etching succeeding thereto. The SOI substrate having the active layer 4 formed thereto by a CVD method is used to form the ink jet nozzle plate.



## LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C): 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平9-216368

(43)公開日 平成9年(1997)8月19日

(51) Int.Cl.<sup>6</sup> B 4 1 J 2/135 識別記号 庁内整理番号

FI

技術表示箇所

B41J 3/04

103N

審査請求 未請求 請求項の数8 OL (全 8 頁)

(21)出願番号

特爾平8-25430

(22)出顧日

平成8年(1996)2月13日

(71) 出願人 000002369

セイコーエプソン株式会社

東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

(72)発明者 紙透 真一

長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコ

ーエブソン株式会社内

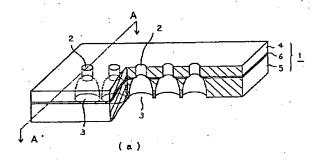
(74)代理人 弁理士 鈴木 喜三郎 (外1名)

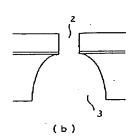
## (54) 【発明の名称】 インクジェットノズルプレートおよびその製造方法

# (57)【要約】

【解決手段】 SOI基板1の活性層4にプラズマエッチングにより、オリフィス2を形成し、SOI基板1の支持体5の対応する部分にテーパ部3を形成することにより、インクジェットノズルプレートを形成する。また、テーパ部3はアルカリ異方性エッチングを行うことにより形成する。また、活性層4がCVD法により形成されているSOI基板を用いて、インクジェットノズルブレートを形成する。

【効果】 形状精度の高いオリフィスおよびテーパ部を 安価に製造することができ、したがって印字品質に優れたインクシェット記録装置を安価に提供できる。





10

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 インクジェット記録装置に用いられ、Si基板を構成部材とするインクジェットノズルブレートにおいて、前記Si基板がSOI基板であり、該SOI基板の活性層に単一または複数のオリフィスが該活性層を貫通するように形成され、該SOI基板の支持体の前記オリフィスに対応する箇所に該支持体を貫通するようにテーバ穴が形成され、前記オリフィスと前記テーバ穴とは連通していることを特徴とするインクジェットノズルプレート。

【請求項2】 前記SOI基板の活性層がCVD法により形成された多結晶Siからなることを特徴とする請求項1記載のインクジェットノズルプレート。

【請求項3】 インクジェット記録装置に用いられ、S i 基板を構成部材とするインクジェットノズルプレートの製造方法において、S i 基板をSOI基板とし、該SOI基板の活性層に単一または複数のオリフィスをブラズマエッチングによって該活性層を貫通するように形成し、該SOI基板の支持体の前記オリフィスに対応する箇所に、該支持体を貫通するようにプラズマエッチング 20によってテーパ穴を形成し、前記オリフィスと前記テーパ穴とを連通させることを特徴とするインクジェットノズルプレートの製造方法。

【請求項4】 インクジェット記録装置に用いられ、Si基板を構成部材とするインクジェットノズルプレートの製造方法において、Si基板をSOI基板とし、該SOI基板の活性層に単一または複数のオリフィスをプラズマエッチングによって該活性層を貫通するように形成し、該SOI基板の支持体の前記オリフィスに対応する箇所に、該支持体を貫通するようにアルカリ異方性エッチングによってテーパ穴を形成し、前記オリフィスと前記テーパ穴とを連通させることを特徴とするインクジェットノズルプレートの製造方法。

【請求項5】 インクジェット記録装置に用いられ、Si基板を構成部材とするインクジェットノズルプレートの製造方法において、Si基板をSOI基板とし、該SOI基板の活性層に単一または複数のオリフィスをプラズマエッチングによって該活性層を貫通するように形成し、該SOI基板の支持体の前記オリフィスに対応する箇所に、該支持体を貫通するようにアルカリ異方性エッチングに続いてプラズマエッチングによってテーパ穴を形成し、前記オリフィスと前記テーパ穴とを連通させることを特徴とするインクジェットノズルプレートの製造方法。

【請求項6】 前記SOI基板の活性層がCVD法により形成されていることを特徴とする請求項3乃至5記載のインクジェットノズルプレートの製造方法。

【請求項7】 前記オリフィスの製造方法が、ハロゲン 系ガスを用いたプラズマエッチングによることを特徴と する請求項3乃至6記載のインクジェットノズルプレー 50

トの製造方法。

【請求項8】 前記テーパ穴のプラズマエッチングによる製造方法が、フッ素系ガスを用いたプラズマエッチングによることを特徴とする請求項3または5または6記載のインクジェットノズルプレートの製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明はインク滴を紙等に吐出し印字するインクジェット記録装置のヘッド部において用いられる、インク滴の吐出口となるノズルが形成されているインクジェットノズルブレートおよびその製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】とれまで、さまざまな形式のインクジェ ット記録装置が開発されてきたが、その中で、本出願人 が特開平5-50601号公報において提案した静電気 を駆動力とするインクジェット記録装置は、髙印字品質 ・長寿命という特徴を有するものであるが、このインク ジェット記録装置の一方式として、ノズルが基板表面に 形成されるフェイス型インクジェットヘッドが提案され ている。また、本出願人は特開平4-312853号公 報において髙密度の、すなわち、インク滴の吐出口であ るノズル間ピッチの小さいSi製インクジェットノズル プレートの製造方法を提案している。これらのインクジ ェット記録装置またはインクジェットノズルプレートを 用いたインクジェット記録装置においては、それまでの インクジェット記録装置に比べて高い印字品質および耐 久性が得られたが、たとえば、前記の特開平4-312 853号公報で提案されているインクジェットノズルブ レートでは、オリフィスの長さにおいて±3ミクロン程 度のばらつきを有していた。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】一般に、インクジェット記録装置における印字品質は、インク滴の大きさやインク吐出速度といった特性のばらつきに左右され、さらに、これらの特性は、オリフィスの流体抵抗のばらつきにより大きく影響を受ける。さらに高い印字品質を得たい場合には、オリフィスの径や長さ等の寸法の公差が厳しくなり、具体的には、±1ミクロン程度の加工精度が要求されている。

【0004】そこで本発明は、上記したような課題を解決するもので、その目的とするところは高印字品質のインクジェット記録装置に必要とされるノズル各部の寸法はらつきが小さいインクジェットノズルプレートを提供するところにある。また、その他の本発明の目的は、ノズル各部の寸法はらつきが小さいインクジェットノズルプレートを安価に提供するところにある。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明のインクジェット ノズルブレートは、インクジェット記録装置に用いら れ、Si基板を構成部材とするインクジェットノズルブレートにおいて、前記Si基板がSOI基板であり、SOI基板の活性層に単一または複数のオリフィスが活性層を貫通するように形成され、SOI基板の支持体のオリフィスに対応する箇所に支持体を貫通するようにテーパ穴が形成され、オリフィスとテーパ穴とは連通していることを特徴とする。

【0006】SOI(Silicon on Insulator)基板はLSIの高速化を目的として開発されてきた、基板中にSiO、層を有するSi基板である。SOI基板は、一般的には、数百ミクロンの厚みの支持体と呼ばれるSi板の上に誘電体層としてSiO、層が形成され、その上に活性層と呼ばれる薄い(0.数~数ミクロン)Si層が形成されているもので、活性層の厚みは非常に高い精度で形成される(一般的には厚み精度 0.01ミクロン)が、LSI製造に使用する場合は、活性層に集積回路が形成される。本発明においては、SOI基板を用い、SOI基板の活性層にインクを紙等に吐出する穴であるオリフィスを形成することによって、オリフィスの長さを活性層の厚みと同一にすることで非常に高い形状精度とすることができる。

【0007】また、本発明のインクジェットノズルプレートは、前記SOI基板の活性層がCVD法により形成された多結晶Siからなることを特徴とする。

【0008】SOI基板は、一般的には、貼り合わせ法と呼ばれる方法により製造される。この方法では、活性層となるべきSi基板と支持体となるべきSi基板の貼り合わせ面のどちらかまたは両方ともに熱酸化法によりSiO、膜を形成した後、両基板を貼り合わせ、活性層となるSi基板を研磨等の方法により、所望厚みに加工 30するものであるが、貼り合わせや研磨等の工程に時間を要するために製造コストが非常に高い。本発明では、活性層として支持体上に、CVD法により形成されたSi層を活性層として用いるので、SOI基板の製造コストが低いという利点がある。

【0009】また、本発明のインクジェットノズルプレートの製造方法は、前記したオリフィスをプラズマエッチングにより形成すること、さらにプラズマエッチングはハロゲン系ガスを用いていることを特徴とし、また、前記テーパ穴をプラズマエッチングにより形成し、さらにこのプラズマエッチングではフッ素系ガスを用いていることを特徴とする。また、テーパ穴の形成方法としては、アルカリ異方性エッチングにより形成することも特徴とする。

【0010】プラズマエッチングは、一般的に、エッチングガスの種類・圧力・プラズマを発生させるための電力等の条件を整えるととにより形状精度が良いエッチングが可能である。特に、Siはその塩化物、フッ化物等のハロゲン化物の蒸気圧が高いために塩素系、またはフッ素系のガス等を用いてのプラズマエッチングにより、

エッチングレートが大きく、かつ、良好な形状精度での加工が可能であるが、SOI基板中のSiO、層がプラズマエッチングにおいてエッチングストップ層として働くために、前記オリフィスおよびテーバ穴の深さは、非常に精度良く形成できる。アルカリ異方性エッチングにより形成されるテーバ形状もインクジェットノズルのテーバ穴の形状としてふさわしいものであり、かつ、前記のように、SOI基板中のSiO、層がアルカリ異方性エッチングにおいてもエッチングストップ層として働くために、前記テーバ穴の深さは、非常に精度良く形成できる。

【0011】また、本発明のインクジェットノズルブレートの製造方法は、前記テーパ穴をアルカリ異方性エッチングに続いてプラズマエッチングにより形成することを特徴とする。アルカリ異方性エッチングにより形成されるテーパ穴にさらにプラズマエッチングを施すことによって得られるテーパ穴の形状もインクジェットノズルのテーパ穴の形状としてふさわしいものである。

[0012]

【発明の実施の形態】以下本発明の好適な例を、図面を 用いて詳細に説明する。

【0013】図1(a)は、本発明の第1の実施例にお けるインクジェットノズルプレートの斜視図であり、一 部断面を示してある。図1(b)は、図1(a)のA-A´のノズル部分の拡大断面図である。図1に示すよう に、本実施例におけるインクジェットノズルプレート は、オリフィス2がSOI基板1の活性層4中に形成さ れ、テーパ部3は、支持体5に形成されてなる構造を有 し、SOI基板1は内部にSiの熱酸化膜(SiO,) である誘電体層6により活性層4及び支持体5は電気的 に分離されているものであるが、活性層4及び支持体5 はともにSi単結晶からなる。図1に示したインクジェ ットノズルプレートの製造工程を図2に示す。活性層4 の厚みが15ミクロン、誘電体層6の厚みが0.1ミク ロン、支持体5の厚みが100ミクロンであるようなS ○ I 基板 1 (活性層 4 および支持体 5 の結晶面方位はと もに(100)面である)を水蒸気を含む酸素雰囲気に おいて摂氏1100度、4時間の熱処理を行い、SOI 基板1の両面に厚み1.5ミクロンの熱酸化膜8・9を 40 形成する(図2(a))。ついで、熱酸化膜8・9にフ ォトエッチング処理を施すことにより、それぞれにオリ フィス2およびテーパ部3に対応するパターンを加工す る(図2(b))。次に、熱酸化膜8が形成されている 面(活性層側の面)に第1回目のプラズマエッチング処 理を施し、オリフィス2を形成する(図2(c))。C のプラズマエッチングにはハロゲン(フッ素、塩素、臭 素) 系のガスを用い、基板表面に対して垂直な穴が加工 されるような条件を用いることによりオリフィス2の壁 面がSO1基板1の表面に対し、ほぼ垂直であるような 50 加工を施すことができる。また、プラズマエッチング処 20

理は、エッチング除去されるべきSiかすべて除去され たところで誘電体層6が露出することにより自動的にエ ッチングは終了し(エッチストップ)、そのときのオリ フィス長さは活性層4の厚みと同一となるよう加工され -る<del>。す</del>なわち、プラズマエッチングでのウェハ内、バッ-チ間におけるSiのエッチングレートにばらつきがあっ たとしても、活性層4の厚みばらつきの範囲内(±0. 01ミクロン程度)で一定の長さのノズルが容易に形成 できる。ハロゲン系のガスを用いたプラズマエッチング ではSiのエッチングレートに比べ、SiO、のエッチ ングレートは非常に小さいため、エッチストップが可能 となる。次に、テーパ部3を形成するために、テーパ部 3の形成される面に第2回目のプラズマエッチング処理 を施す。このプラズマエッチングにおいては、オリフィ ス2を形成した第1回目のプラズマエッチングの条件と 異なり、フッ素系のガスを主に用いることによりアンダ ーカット量の多いテーバ形伏に加工することができる (図2(d))。オリフィスの加工と同様にテーパ部3 の加工でもプラズマエッチング処理は被加工部の底面で 誘電体層6が出現したところで自動的に終了となるた め、テーパ部3も非常に精度良く加工できる。最後に、 SOI基板1全体をフッ酸系エッチング液に浸漬し、熱 酸化膜8・9と、オリフィス2とテーパ部3との間の誘 電体層6を除去し、インクジェットノズルプレートが完 成する(図2(e))。本実施例におけるインクジェッ トノズルプレートは、インク液の流路となるノズル(オ リフィス2およびテーバ部3)の加工精度は、寸法設計 値に対し±1ミクロン以内に仕上がっており、すなわ ち、インク液の流れに対する流体抵抗は、ノズル間での ばらつきが非常に小さく、このインクジェットノズルブ レートを用いて組み立てられたインクジェット記録装置 により印字検査を行ったところ、ノズル間でのインク吐 出量および速度のばらつきが非常に小さく、印字品質に 優れたインクジェット記録装置を提供することができ た。本実施例では、活性層4および支持体5はともに (100) 面方位であったが、(110) 等の他の面を 用いても、また、活性層と支持体の面方位が異なるよう な組み合わせであっても上記の効果は変わるところはな

[0014] 次に、本発明の別の実施例(第2の実施例)について詳細に説明する。

43

【0015】図3(a)は本発明の第2の実施例におけるインクジェットノズルブレートの斜視図であり、一部断面を示してある。図3(b)は図3(a)のA-Aのノズル部分の拡大断面図である。図3に示したように、本実施例におけるインクジェットノズルプレートは、本発明の第1の実施例と同様にSOI基板を加工したものであるが、支持体5aに形成されるテーバ部3aはアルカリを用いた結晶異方性エッチングにより形成されるものである。図3に示したインクジェットノズルブ

レートの製造工程を図4に示す。活性層4 a、誘電体層 6 a および支持体5 a の厚みはそれぞれ本発明の第1の 実施例の場合と同一であるSOI基板1a(ただし、活 性層4aおよび支持体5aの結晶面方位は(110)面 である)-に本発明の第-1-の実施例の場合と同様に熱酸化 膜8a・9aを形成し(図4(a))、ついで熱酸化膜 8 a・9 a にそれぞれオリフィス2 a およびテーバ部3 aに対応するパターンを形成する(図4(b))。その 際、熱酸化膜8aのフッ酸系エッチング液によるエッチ ングはSi〇、の厚み方向において一部(0.7ミクロ ン)を残すようにハーフエッチングする。また、熱酸化 膜9のパターンはSiの湿式アルカリ異方性エッチング によりテーパ部3aを形成するための結晶方位に依存し たパターンである。図4(c)の工程において上記のア ルカリを用いた結晶異方性エッチングを行い、テーパ部 3 a を形成する。本実施例においては、アルカリ液とし て、濃度17重量パーセントのKOH水溶液を摂氏80 度に加熱したものを用い、所定時間のエッチングを施し た。所定時間とは、1バッチ内で支持体5 a の厚みの最 も厚い部分(本実施例では厚みの平均値+10ミクロン 以下) がエッチングにより貫通できる時間である。この 場合、支持体5aの厚みのより薄い部分では、オーバエ ッチングとなるが第1の実施例の場合と同様に、支持体 5aがすべてエッチングされた時点で誘電体層6aが出 現し自動的にエッチストップとなる。次に、SOI基板 1 aをフッ酸系エッチング液により処理し、熱酸化膜8 aのうち図4(b)の工程においてハーフェッチングに より残した部分を除去する(図4(d))。当初この部 分のSi〇、厚みは〇、7ミクロンであったが図4 (c)の工程において約0.3ミクロンとなっており、

上記のフッ酸系エッチング液によるエッチングでは0. 3 ミクロンのSiO, が充分に除去できる時間だけ処理 すればよい。次に、熱酸化膜8a側の面のプラズマエッ チング処理を、本発明の第1の実施例と同様に行い、オ リフィス2 a を形成する(図4(e))。最後に、SO I基板1a全体をフッ酸系エッチング液に浸漬し、熱酸 化膜8a・9aを除去し、インクジェットノズルブレー トが完成する(図4(f))。本実施例におけるインク ジェットノズルプレートは、インク液の流路となるノズ ル (オリフィス2 a およびテーバ部3 a) の加工精度 は、第1の実施例と同様に、寸法設計値に対し±1ミク ロン以内に仕上がっており、流体抵抗値のばらつきは非 常に小さい。本実施例では、活性層4 a および支持体5 aは (110) 面方位であったが、 (100) 等の他の 面方位であっても上記した効果に変わるところはない。 【0016】次に、本発明の別の実施例(第3の実施 例)について詳細に説明する。

【0017】図5(a)は、本発明の第3の実施例におけるインクシェットノズルプレートの斜視図であり、一部断面を示してある。図5(b)は図5(a)のA-A

´のノズル部分の拡大断面図である。図5に示したよう に、本実施例におけるインクジェットノズルプレート は、本発明の第1の実施例と同様にSOI基板を加工し たものであるが、支持体5 b に形成されるテーパ部3 b はアルカリを用いた結晶異方性エッチングおよびプラズ マエッチングにより形成されるものである。図5に示し たインクジェットノズルプレートの製造工程を図6に示 す。活性層4b、誘電体層6bおよび支持体5bの厚み はそれぞれ本発明の第1の実施例の場合と同一であるS OI基板1b(ただし、活性層4bおよび支持体5bの 結晶面方位は(100)面である)に本発明の第1の実 施例の場合と同様に熱酸化膜8b・9bを形成し(図6 (a))、熱酸化膜8b・9bにそれぞれオリフィス2 bおよびテーパ部3bに対応するパターンを形成する (図6(b))。その際、熱酸化膜8bのフッ酸系エッ チング液によるエッチングはSiO,の厚み方向におい て一部(0.7ミクロン)を残すようにハーフエッチン グする。また、テーパ部3 b に対応するパターンの形状 は正方形とし、たとえばその一辺の長さは110ミクロ ンとする。次に、本発明の第2の実施例と同様に湿式ア ルカリ異方性エッチングを所定時間行い、逆ピラミッド 型の穴10bを形成する(図6(c))。ついで、本発 明の第1の実施例と同様に、熱酸化膜9 bの側を主にフ ッ素系のガスを用いたプラズマエッチングにより、アン ダーカット量の多い条件にて、誘電体層6 b が出現する まで加工を行い、テーバ部3bを形成する(図6 (d))。次に、SOI基板1bをフッ酸系エッチング 液により処理し、熱酸化膜8 b のうち図6 (b) の工程 においてハーフェッチングにより残した部分を除去する (図6(e))。 当初との部分のSiO, 厚みはO. 7 ミクロンであったが図6(c)の工程において約0.3 ミクロンとなっており、上記のフッ酸系エッチング液に

よるエッチングでは0.3ミクロンのSiO,が充分に 除去できる時間だけ処理すればよい。次に、熱酸化膜8 bの側を本発明の第1または第2の実施例の場合と同様 に、基板表面に対し、垂直穴が加工できる条件にて、S O I 基板 1 b が貫通するまでプラズマエッチングを行っ て、オリフィス2bを形成し(図6(f))、最後にS O I 基板 1 b 全体をフッ酸系エッチング液に浸漬し、熱 酸化膜8b・9bを除去し、インクジェットノズルプレ ートが完成する(図6(g))。本実施例におけるイン クジェットノズルプレートでは、本発明の第1 および第 2の実施例に比べ(図1(b)、図3(b)、図5 (b)を比較)、テーパ穴3bのアスペクト比(深さ/

平面寸法)を大きくできるため、ノズルの流路抵抗値の 選択の幅が拡大する。また、テーパ穴加工でのプラズマ エッチング量の割合が減少するので、低コスト化が実現 できる。本実施例では、活性層4 bは(100)面方位 であったが、(110)等の他の面であっても上記の効 果に変わるところはない。

【0018】次に、本発明の別の実施例(第4の実施 例) について詳細に説明する。

【0019】本実施例におけるインクジェットノズルブ レート (図示しない) は、本発明の第1の実施例と同様 にSOI基板を加工したもので、寸法・形状・加工プロ セス等は本発明の第1の実施例と基本的に同一である。 異なる点は、活性層が単結晶Siではなく、CVD法に より形成された多結晶Siからなることである。前記の ように、CVD法により活性層を形成することにより、 本実施例において、本発明の第1の実施例の場合と同一 条件により、活性層に対し、SOI基板表面に対して加 工面が垂直にできるようなプラズマエッチング処理を施 すが、本プラズマエッチング処理におけるエッチングレ ート・寸法・形状は被加工材の結晶性(単結晶である か、多結晶であるか)にはほとんど依存せず、すなわ ち、寸法・形状に関しては、本発明の第1の実施例の場 合とほぼ同一であり、設計規格である±1ミクロン以内 が達成されている。したがって、本実施例におけるイン クジェットノズルプレートを用いたインクジェットへッ ドでのインク吐出特性は本発明の第1の実施例の場合と 同様に、印字品質に優れており、かつ、このようなイン クジェットノズルプレートを安価に提供することができ た。

### [0020]

【発明の効果】以上に記したように、本発明によれば、 Si基板を構成部材とするインクジェットノズルプレー トにおいて、SOI基板を用い、SOI基板の活性層お よび支持体にノズルとなるべきオリフィスおよびテーパ 部を形成することにより非常に高精度のインクジェット ヘッド用のノズルが加工でき、したがって、高印字品質 のインクジェットヘッドを提供することができる。

【0021】また、本発明によれば、前記オリフィスは プラズマエッチングにより形成され、前記テーバ部はプ ラズマエッチングまたはアルカリ異方性エッチングまた はアルカリ異方性エッチングに続いてプラズマエッチン グを行うことにより形成されることにより、高精度なノ ズルを得ることができ、したがって、高印字品質のイン クジェットヘッドを提供することができる。

【0022】また、本発明によれば、前記活性層をCV Dにより形成することにより、高精度なノズルプレート を安価に提供することができる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例におけるインクジェットノズ ルプレートの一部断面を示す斜視図およびノズル部の拡 大断面図である。

【図2】本発明の一実施例におけるインクジェットノズ ルプレートの製造工程図である。

【図3】本発明の別の一実施例におけるインクジェット ノズルプレートの一部断面を示す斜視図およびノズル部 50 の拡大断面図である。

【図4】本発明の別の一実施例におけるインクジェット ノズルブレートの製造工程図である。

【図5】本発明のさらに別の一実施例におけるインクジ ェットノズルプレートの一部断面を示す斜視図およびノ ズル部の拡大断面図である。....

【図6】本発明のさらに別の一実施例におけるインクジ ェットノズルプレートの製造工程図である。

# 【符号の説明】

1, la, 1b SOI基板

\*2, 2a, 2b オリフィス

3, 3a, 3b テーバ部

4, 4a, 4b 活性層

支持体 5, 5a, 5b

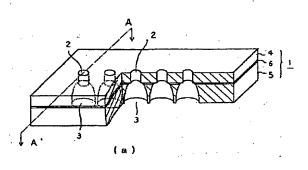
誘電体層... 6.- 6-a---6-b

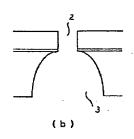
8, 8a, 8b 熱酸化膜

9, 9a, 9b 熱酸化膜

10b 逆ピラミッド型の穴

【図1】





【図2】

